

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 19 年 8 月 30 日 (2007.8.30)

【公表番号】特表 2007-502462(P2007-502462A)
 【公表日】平成 19 年 2 月 8 日 (2007.2.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2007-005
 【出願番号】特願 2006-523198(P2006-523198)
 【国際特許分類】

G 0 6 F 11/28 (2006.01)

G 0 6 F 15/78 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 11/28 L

G 0 6 F 15/78 5 1 0 K

G 0 6 F 15/78 5 1 0 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 7 月 4 日 (2007.7.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

デバッグ回路のセキュリティを確保する方法であって、
 デバッグ回路をイネーブルの状態にする工程と、
 第 1 不揮発性素子に書き込みを行なってデバッグ回路をディスエーブルにする工程と、
 第 1 不揮発性素子に書き込みを行なった後に第 2 不揮発性素子に書き込みを行なって、デ
 バッグ回路を再イネーブルする操作およびデバッグ回路を永久的にディスエーブルにする
 操作の内の一つを実行する工程と、
 からなる方法。

【請求項 2】

第 1 不揮発性素子に書き込みを行なった後で、かつ第 2 不揮発性素子に書き込みを行なう
 前に、デバッグ回路を、認証操作に応答して選択的にイネーブルにすることができる請求
 項 1 記載の方法。

【請求項 3】

第 1 不揮発性素子は第 1 フューズを含み、そして第 2 不揮発性素子は第 2 フューズを含み、そして

第 1 不揮発性素子に対する書き込みでは第 1 フューズを飛ばし、そして

第 2 不揮発性素子に対する書き込みでは第 2 フューズを飛ばす、請求項 1 記載の方法。

【請求項 4】

デバッグ回路のセキュリティを確保する方法であって、

デバッグ回路を、認証操作に応答して選択的にイネーブルにすることができるセキュアデ
 バッグ状態にする工程と、

デバッグ回路を認証操作に応答してイネーブルにする工程と、

デバッグ回路を認証操作に応答してイネーブルにした後、第 1 不揮発性素子に書き込みを
 行なう工程と、

第 1 不揮発性素子に書き込みを行なった後に第 2 不揮発性素子に書き込みを行ない、第
 2 不揮発性素子に書き込みを行なった後、デバッグ回路は再びイネーブルセキュアデバッ

グ状態になり、同再びイネーブルセキュアデバッグ状態では、デバッグ回路を認証操作に応答して選択的にイネーブルにすることができる、方法。

【請求項 5】

デバッグ回路と、

第 1 不揮発性素子と、

第 2 不揮発性素子と、

第 1 不揮発性素子及び第 2 不揮発性素子に基づいて、デバッグイネーブル表示子をデバッグ回路に供給するデバッグイネーブル回路と、

を備え、

第 1 不揮発性素子は、デバッグ回路が、認証操作に応答して選択的にイネーブルにすることができるセキュアデバッグ状態にあるかどうかを示し、

第 2 不揮発性素子は、第 1 不揮発性素子による設定を無効にすべきかどうかを示す、集積回路。